



张希珍

副教授

zhangxizhen@dlmu.edu.cn

教育背景

日本产业技术综合研究所 博士后、访问研究员（2008-2012）

吉林大学理学 博士（2002-2007）

吉林大学工学 学士（1998-2002）

研究领域

小尺寸 MOS 电容模型及其测量方法；稀土发光材料；铁电场存储器材料与器件；聚合物光波导器件

代表性成果

论文：

[1] X. Zhang*, C. Cheng, H. Zhu et al., IEEE Electron Device Lett., 37, 1328-1331, 2016.

[2] X. Zhang*, H. Zhu, C. Cheng et al., Solid-State Electron., 129, 97-102, 2017.

[3] X. Zhang*, S. Zhang, H. Zhu et al., J. Phys. D: Appl. Phys., 51, 055105, 2018.

[4] X. Zhang*, S. Zhang, H. Zhu et al., J. Nanosci. Nanotechnol., 18, 7473 - 7478, 2018.

[5] Xizhen Zhang*, Sujuan Zhang, Xiuyu Pan et al., Semicond. Sci. Technol., 33, 115006, 2018.

[6] Xizhen Zhang*, Xiuyu Pan, Yi Cheng et al., Results in Physics, 12, 681-686, 2019.

[7] Xizhen Zhang, Lizhu Guo, Yuhang Zhang et al., Journal of the American Ceramic Society, 103, 5028-5035, 2020.

[8] Xizhen Zhang, Lizhu Guo, Yuhang Zhang et al., Journal of Non-Crystalline Solids 541, 120066, 2020.

[9] Lizhu Guo, Xizhen Zhang*, Yuhang Zhang et al., Journal of

Non-Crystalline Solids, 551, 120432, 2021.

[10] Xizhen Zhang, Mengqi Lin, Lizhu Guo et al., Optics and Laser Technology, 138, 106857, 2021.

[11] Mengqi Lin, Xizhen Zhang*, Lizhu Guo et al., Optical Materials, 122, 111654, 2021.

[12] Lizhu Guo, Xizhen Zhang*, Mengqi Lin et al., Optik, 248, 168156, 2021.

[13] Linke Song, Xizhen Zhang*, Mengqi Lin et al. J. Opt. Soc. Am. B, 39, 2120-2128, 2022.

[14] Mengqi Lin, Xizhen Zhang*, Lizhu Guo et al., J. Lumin., 252, 119342, 2022.

[15] Mengqi Lin, Xizhen Zhang *, Yabo Dong, et al., Ceramics International, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.03.151>

专利:

[1]张希珍, 陈宝玖, 于涛, 一种基于五元素模型的 MOS 电容测量方法, 发明专利, ZL201610522936.X。2018.9.20 授权

[2]张希珍, 陈宝玖, 一种钙钛矿量子点微晶玻璃为增益介质的激光器, 发明专利, 申请号 201910839319.6。

[3]张希珍, 陈宝玖, 于涛, 一种 LED 结合钙钛矿量子点微晶玻璃的显示用宽色域背光源, 发明专利, 申请号 ZL201910838827.2。2020.11.25 授权。

代表性项目

(1) 辽宁省博士启动基金,20170520082, 超薄 MOS 电容模型及测量方法研究, 2017/09-2019/08, 在研, 主持。

(2) 横向项目, 技术开发(委托)合同, MOD 材料在 MOS 电容应用中的技术开发, 2018/04-2019/04, 在研, 主持。

荣誉奖励

(1) 2018 年辽宁省自然科学优秀成果奖-优秀论文三等奖、论文名: A new MOS capacitance correction method based on five-element model by combining double-frequency C-V and I-V measurements, X. Zhang, C. Cheng, H. Zhu, T. Yu, 张希珍, 程传辉, 朱慧超,

于涛, 辽宁省科学技术协会, 辽宁省自然科学学术成果奖评审委员会。

(2) 2018 年 Quarterly Franklin Membership (Membership ID#KN22360), 论文名 “Single Frequency Correction Based on Three-Element Model for Thin Dielectric MOS Capacitor”, “Frequency Dispersion Analysis of Thin Dielectric MOS

Capacitor in a Five-Element Model”，奖励部门 London Journals Press (UK)。

(3) 2018 年 Semiconductor Science and Technolgy Outstanding Reviewer Award 优秀审稿人奖，奖励部门 IOP Pressing.

(4) 2022 年被评为大连海事大学优秀硕士研究生导师。

(5) 2022 年 12 月 20 日，钙钛矿量子点玻璃光学特性及其应用研究，大连海事大学优秀学术成果奖 2019-2021 年度优秀学术论文奖一等奖

社会兼职

IEEE 电气电子工程师学会会员，大连市科技项目评审专家

其他